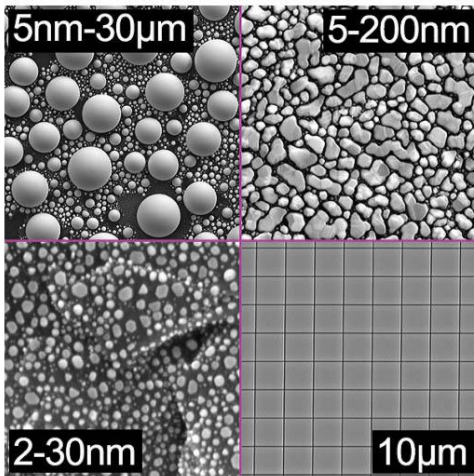


EM-Tec マルチ標準サンプル



31-023404 EM-Tec M4-4 マルチ標準サンプル

カーボンフィルム上の 1) Sn、2) Au、3) 高面分解能 Au および M-10 シリコングリッド

イントロダクション

EM-Tec のマルチおよびコンビネーションスタンダードは、最大 3 種類の標準サンプルと、10 μ m のキャリブレーションパターンを備えた M-10 シリコンチップを SEM スタブ上に載せて提供します。異なる規格の標準サンプルの組み合わせにより、異なるスケールの規格を迅速に同じスタブ上で移行することができます。複数の SEM 標準サンプルの組合せは、複数の SEM をお持ちのユーザーが、SEM の性能を迅速に評価するのに理想的です。10 μ m シリコングリッド上の Sn 球とのコンビネーション標準サンプルは、卓上 SEM の較正にお勧めです。

EM-Tec マルチ標準サンプルの組合せ

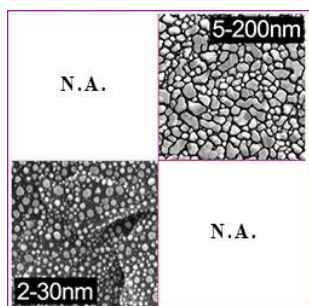
EM-Tec マルチ標準サンプルに使用される標準サンプルの組合せは次のとおりです。(1 個のスタブに取付けられる標準サンプル数は 4 種までです。)

- EM-Tec Au on C 標準サンプル 1、5-200nm ゴールドアイランド分解能テスト標準サンプル
- EM-Tec Au on C 高面分解能(hires)標準サンプル 3、3-50nm ゴールドアイランド分解能テスト標準サンプル (FESEMにお勧め)
- EM-Tec Sn on C 解像度標準サンプル 6、5nm~30 μ m の Sn 粒子、すべての SEM での非点収差補正と画像シフト補正用
- EM-Tec M-10 キャリブレーション標準サンプル (10 μ m 規模の校正と画像歪み評価のためのシリコン上の 10 μ m グリッドパターン付き)

6 種類の EM-Tec マルチ標準サンプル

パーツ番号	品名	分解能テスト標準サンプル			校正標準サンプル
		Au on C	高面分解能 Au on C	Sn on C	M-10 10 μ m グリッド
31-023102	EM-Tec M1-2	○	○	—	—
31-023202	EM-Tec M2-2	○	—	○	—
31-023303	EM-Tec M3-3	○	○	○	—
31-023404	EM-Tec M4-4	○	○	○	○
31-023502	EM-Tec M5-3	○	—	○	○
31-023602	EM-Tec M6-2	—	—	○	○

31-023102 EM-Tec M1-2 EM-Tec マルチ(2 種)標準サンプル(Au on C + 高面分解能 Au on C)

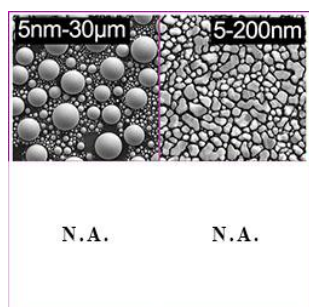


EM-Tec M1-2 は、C 上の粒径 5-200nm の Au および粒径 3-50nm の Au の 2 種類の標準サンプルで構成されています。
高倍率での標準 SEM および FESEM の解像度およびグレーレベルのチェックに適しています。

EM-Tec M1-2 EM-Tec マルチ(2 種)標準サンプル(Au on C + 高面分解能 Au on C)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023102-1	1 個	Ø 12.7mm ピンスタブ	¥91,100
31-023102-6	1 個	Ø12.2mm J スタブ	¥91,100
31-023102-8	1 個	Ø15mm M4 スタブ	¥91,100

31-023202 EM-Tec M2-2 EM-Tec マルチ(2 種)標準サンプル(Sn on C + Au on C)

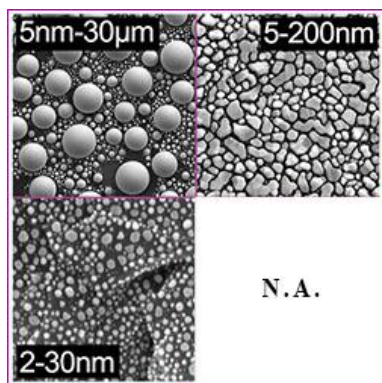


EM-Tec M2-2 マルチ(2 種)標準サンプルは C 上の粒径 5nm-30 μ m の Sn と粒径 5-200nm の Au の 2 種類の標準サンプルで構成されています。
テーブルトップ SEM および中～高倍率の標準 SEM での非点収差、解像度およびグレーレベルのチェックに適しています。

EM-Tec M2-2 EM-Tec マルチ(2 種)標準サンプル(Sn on C + Au on C)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023202-1	1 個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥61,300
31-023202-6	1 個	Ø12.2mm J スタブ	¥61,300
31-023202-8	1 個	Ø15mm M4 スタブ	¥61,300

31-023303 EM-Tec M3-3 EM-Tec マルチ(3種)標準サンプル (Sn on C + Au on C + hires Au on C)



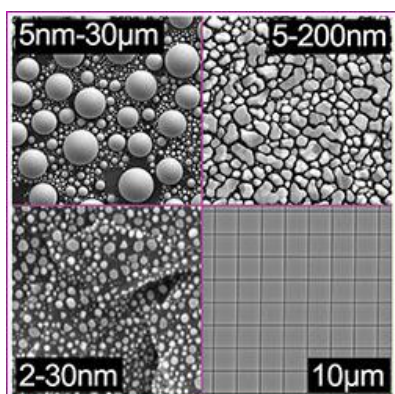
EM-Tec M2-3 マルチ(3種)標準サンプルはC上の5nm-30µmのSn、粒径5-200nmのAuおよび粒径3-50nmの3種類の標準サンプルで構成されています。

標準SEMおよびFESEMでの非点収差、解像度およびグレーレベルのチェックに適しています。

EM-Tec M3-3 マルチ(3種)標準サンプル (Sn on C + Au on C + hires Au on C)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023303-1	1個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥120,300
31-023303-6	1個	Ø12.2mm Jスタブ	¥120,300
31-023303-8	1個	Ø15mm M4スタブ	¥120,300

EM-Tec M4-4 マルチ(4種)標準サンプル (Sn on C + Au on C + hires Au on C + 10µm Si グリッド)



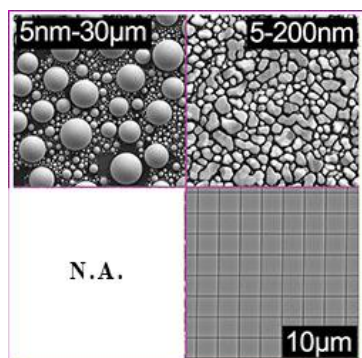
マルチ(4種)標準サンプルはC上の5nm-30µmのSn、粒径5-200nmのAu、粒径3-50nm、および10µm Siグリッドの4種類の標準サンプルで構成されています。

標準SEMおよびFESEMでの非点収差、解像度およびグレーレベルの低倍率から高倍率のチェックに適しています。

EM-Tec M4-4 マルチ(4種)標準サンプル (Sn on C + Au on C + hires Au on C +10µm Si グリッド)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023404-1	1個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥136,900
31-023404-6	1個	Ø12.2mm Jスタブ	¥136,900
31-023404-8	1個	Ø15mm M4スタブ	¥136,900

31-023503 EM-Tec M5-3 マルチ(3種)標準サンプル

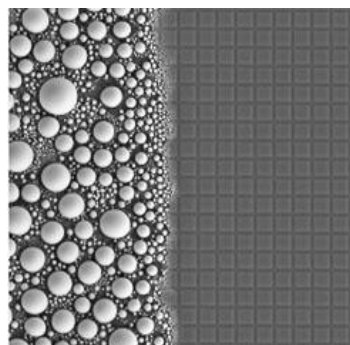


EM-Tec M5-3 マルチ(3種)標準サンプルはC上の5nm-30µmのSn粒径5-200nmのAu、および10µm Siグリッドの3種類の標準サンプルで構成されています。標準SEMおよびテーブルトップSEMでの非点収差、解像度およびグレーレベルの低倍率から高倍率のチェックに適しています。

EM-Tec M5-3 マルチ(3種)標準サンプル(Sn on C + Au on C +10µm Siグリッド)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023503-1	1個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥84,800
31-023503-6	1個	Ø12.2mm Jスタブ	¥84,800
31-023503-8	1個	Ø15mm M4スタブ	¥84,800

31-023602 EM-Tec M6-2 マルチ(2種)標準サンプル (Sn on 10µm シリコングリッド)



EM-Tec M6-2 マルチ(2種)標準サンプルは、Sn(5nm-30µm)が10µm シリコングリッド上に載った標準サンプルです。この組合せは、標準SEMおよびテーブルトップSEMでの非点収差、解像度およびグレーレベルの低倍率から高倍率のチェックに適しています。

EM-Tec M6-2 マルチ(2種)標準サンプル (Sn on 10µm シリコングリッド)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023602-1	1個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥70,300
31-023602-6	1個	Ø12.2mm Jスタブ	¥70,300
31-023602-8	1個	Ø15mm M4スタブ	¥70,300

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。